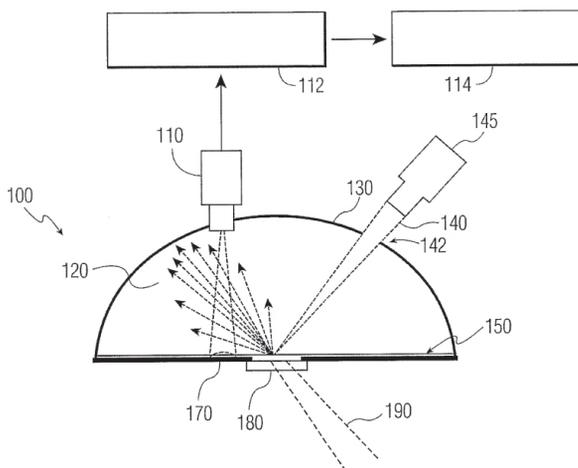


테스트 표면의 광학 검사
(OPTICAL INSPECTION OF TEST SURFACES)

출원번호(일자) : 10-2012-7021482 (2012.08.16)
 번역문제출일자 : 2012.08.16
 공개번호(일자) : 10-2012-0098958 (2012.09.05)
 출원인 : 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔 브이

요약

하나의 양상에서, 가령 파로시아미터(Parosiameter)와 같이 스캐터로미터(100)로부터 얻어진 영상 세기 데이터를 저장 할 필요가 있는 데이터의 양은 상기 광도 데이터가 광도에 대한 변화에 따라 그리드의 다른 영역에서 사용되는 해상도를 변화시킴으로써 줄어든다. 또 다른 양상에서, 스캐터로미터는 상기 테스트 샘플에 대한 거울의 중심이 벗어난 배치에 의해 도입된 왜곡을 수정하기 위해 테스트 샘플(180)을 영상화하는 비구면 거울(170,900,1000)로 제공된다. 또 다른 양상에서, 광학 표면 검사 장치는 상기 테스트 표면에 패턴 그리드(1610)를 투사하기 위하여 테스트 표면(1420)과 조명된 패턴 그리드(1410) 사이에 보조 렌즈(1440)를 사용한다. 카메라(1450)는 실제의 영상으로서 상기 테스트 표면상의 그리드에 초점이 맞춰진다.



양방향 광학 증폭기
(BIDIRECTIONAL OPTICAL AMPLIFIER)

출원번호(일자) : 10-2012-7017759 (2012.07.09)
 번역문제출일자 : 2012.07.09
 공개번호(일자) : 10-2012-0104301 (2012.09.20)
 출원인 : 알까멜 루스트

요약

양방향 광학 증폭기(1)는 다운스트림 광학 신호(SDS)가 하나의 방향으로 그리고 업스트림 광학 신호(SUS)가 대향되는 방향으로 통과하도록 구성되고, 3개의 포트들을 갖는 제 1 광학 서큘레이터(2), 양방향 광학 증폭기의 일 단부에 제 1 커넥터(8)를 규정하는 제 1 광학 서큘레이터의 제 1 포트, 3개의 포트들을 갖는 제 2 광학 서큘레이터(3), 양방향 광학 증폭기의 대향되는 단부에 제 2 커넥터(9)를 규정하는 제 2 광학 서큘레이터의 제 1 포트, 다운스트림 광학 신호에 대한 다운스트림 증폭 경로(5)를 규정하기 위해서 제 1 광학 서큘레이터의 제 2 포트와 제 2 광학 서큘레이터의 제 2 포트 간에 접속된 다운스트림 일방향 광학 증폭기(4), 및 업스트림 광학 신호에 대한 업스트림 증폭 경로(7)를 규정하기 위해서 제 1 광학 서큘레이터의 제 3 포트와 제 2 광학 서큘레이터의 제 3 포트 간에 접속된 업스트림 일방향 광학 증폭기(6)를 포함한다. 양방향 광학 증폭기(1)는 제 1 광학 서큘레이터(2)의 제 2 포트와 다운스트림 일방향 광학 증폭기(4)의 입력부 간에 접속된 주파수 대역 분리기(10)를 추가로 포함한다.

